



ナノテクノロジープラットフォーム 産総研微細構造解析プラットフォーム H29年度 第2回地域セミナー

- 主催：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先端ナノ計測施設（ANCF）
- 共催：文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム
微細構造解析プラットフォーム

－概要－

産総研では、国内の産業力強化と新産業創出の先導や社会イノベーションの貢献を目指して先端計測分析技術の開発を実施しています。その一環として、独自に開発した先端計測や分析機器などを「ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォーム」の制度で公開しています。本セミナーでは、公開装置の概要と測定事例などを紹介します。

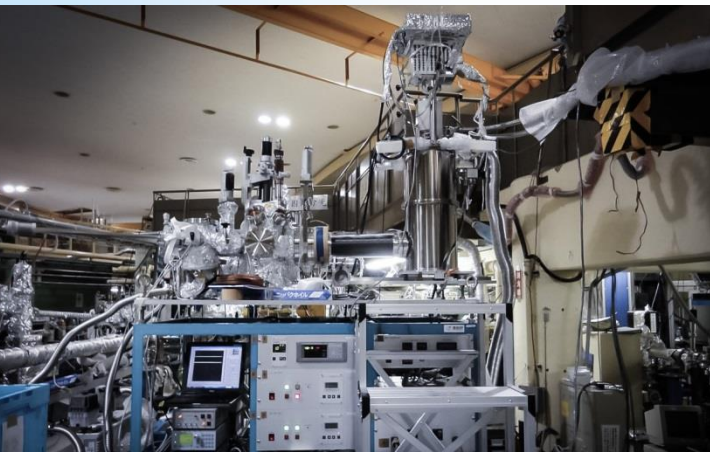
日時

平成29年11月22日（水）
13:30～17:00

開催場所

JST東京本部 別館（K's五番町）
2階セミナー室

参加無料
定員30名



◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門

ANCF問合せ窓口：anct-info-ml@aist.go.jp

：029-861-5300

（当日参加も可能です）

プログラム

13:30	開会 概要説明	分析計測標準研究部門	副研究部門長	齋藤 直昭
13:45	「陽電子プローブマイクロアナライザー装置」	分析計測標準研究部門	主任研究員	O'Rourke Brian
14:10	「超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置」	分析計測標準研究部門	研究主幹	松林 信行
14:35	「極端紫外光光電子分光装置」	ナノエレクトロニクス研究部門	テクニカルスタッフ	石塚 知明
15:00	「超伝導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡」	ナノエレクトロニクス研究部門	グループリーダー	浮辺 雅宏
15:25	休憩			
15:35	「可視-近赤外過度吸収分光装置」	分析計測標準研究部門	主任研究員	松崎 弘幸
16:00	「リアル表面プローブ顕微鏡装置」	分析計測標準研究部門	主任研究員	井藤 浩志
16:25	「固体NMR装置」	物質計測標準研究部門	招聘研究員	林 繁信
16:50	閉会			



JST 国立研究開発法人
科学技術振興機構

市ヶ谷駅から東京本部別館へのアクセス
■JR「市ヶ谷駅」より徒歩3分

■都営新宿線、
東京メトロ南北線・有楽町線
「市ヶ谷駅」(2番出口)より
徒歩3分

JSTのホームページ
https://www.jst.go.jp/koutsu_map2.html より転載

JST東京本部 別館(K's五番町)

〒102-0076
東京都千代田区五番町7 K's五番町

Tel.03-6272-4752



◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門

ANCF問合せ窓口：anct-info-ml@aist.go.jp

：029-861-5300

(当日参加も可能です)